

NO/182/2012

Radom, dnia 2012-10-18

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometru atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP), numer sprawy BP/31/2012, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

- 1) **Dotyczy 1.2. Układ wprowadzania próbki zawierający co najmniej:** 1) 3-kanalową pompę perystaltyczną o szybkości pompowania kontrolowaną z poziomu oprogramowania sterującego komputera w zakresie co najmniej 0-100 obr/min.

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie aparatu o szybkości pompowania do 30 obr/min.?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Możliwość uruchomienia pompy na wysokich obrotach skraca czas płukania pomiędzy próbkami co obniża koszty analizy serii próbek.

- 2) **Dotyczy 1.2. Układ wprowadzania próbki zawierający co najmniej:** 3) semi-rozbieralny palnik kwarcowy z możliwością stosowania rurek o różnej średnicy.

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie palników jednoczęściowych i jednocześnie zaoferowanie odpowiedniej liczby palników adekwatną do wymienionych w p. 1.14, podpunktach 11), 12), odpowiednio 5 palników o średnicy rurki centralnej 2,5 mm i 5 palników do organiki o średnicy rurki centralnej 1,0 mm.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Możliwość wymiany rurki centralnej bez konieczności demontażu palnika skraca czas wymiany układu podawania próbki.

- 3) **Dotyczy 1.4. Interfejs:**

Czy Zamawiający dopuszcza stożki o średnicach odpowiednio: próbkowania - 1 mm i skimmera - 0,4 mm? Powszechnie wiadomo, że mniejsza średnica stożków umożliwia lepszą separację jonów, bez względu na model aparatu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Większe średnice stożków gwarantują minimalizację wpływu osadzania się materiału próbki na krawędziach otworu stożka, jest to szczególnie istotne przy analizie roztworów organicznych.

- 4) **Dotyczy 1.5. Gwarantowany poziom tła:**

Czy Zamawiający dopuszcza również padanie parametru podającego ilość zliczeń dla tła jako wyrażenie go dla rzeczywistej masy analitycznej (9 amu) 2 cps/s w trybie bez komory zderzeniowej i 0.5 zliczeń/s w trybie komory zderzeniowej? Sugerowana masa 4,5 amu wskazuje na tło elektroniczne i nie odpowiada masom rzeczywistym pierwiastków.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Zamawiający wymaga gwarantowanego poziom tła przy całkowitej liczbie masowej wolnej od pików spektralnych w celu ustalenia dopuszczalnego „szumu elektronicznego” generowanego przez przyrząd.

5) **Dotyczy 1.6. Gwarantowana czułość (minimum):**

Czy Zamawiający dopuszcza następujące wartości czułości aparatu:

${}^7\text{Li} \geq 50 \text{ kcps/ppb}$, ${}^{89}\text{Y} \geq 160$, ${}^{205}\text{Tl} \geq 80 \text{ kcps/ppb}$

Celem wyjaśnienia, chcielibyśmy dodać, że powyższe podane przez nas wartości czułości są gwarantowane przez fabrykę, natomiast podczas instalacji zawsze są kilkakrotnie wyższe. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że izotop U (238) będzie charakteryzował się abundancją wyższą, stąd większa ilość zliczeń dla tego konkretnego przykładu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

6) **Dotyczy 1.8. System optyki jonowej:**

Czy Zamawiający zezwala na rozszerzenie specyfikacji o system optyki jonowej złożony z soczewek ekstrakcyjnych i jonowych ułożonych niewspółosiowo, eliminujących fotony oraz cząsteczki obojętne, gwarantujący wysoką transmisję jonów w całym zakresie mas oraz z gwarantowanym poziomem szumów tła $\leq 2 \text{ cps}$ dla wszystkich trybów pracy, jak zaproponowaliśmy w p 5.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

System optyki jonowej z odchyleniem wiązki o 90° , jest nowoczesnym rozwiązaniem gwarantującym zwiększenie czułości i niższy poziom szumów spektrometrów.

7) **Dotyczy 1.9. filtr masowy:**

Czy Zamawiający zezwala na dopuszczenie aparatu o zakresie mas do 260 amu. Powyżej tego zakresu nie ma żadnej masy użytecznej w analizach za pomocą ICP-MS.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Szerokość zakresu mierzonych mas przekłada się na kształt charakterystyki czułości spektrometru.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych